

表面觀察

用於半導體晶圓 / 晶粒、光阻、聚合物表面觀察的奈米級解決方案

桌上型高解析度 FE-SEM ！ **業界首創**

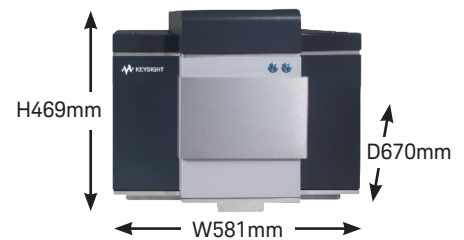


利用 U9320B FE-SEM（場發射掃描電子顯微鏡）建構的高解析度、小尺寸的經濟型表面觀察系統

“空間有限，但需要高解析度 SEM ？”
“想要形成非導電或能量敏感表面形貌？”
“想在觀察之前縮短準備時間？”
沒問題，讓我們當您的後盾！

實現真正的小型化 FE-SEM ！

是德科技獨家開發了全新的微型靜電束柱（electrostatic beam column），包括 FE 電子源和靜電透鏡。它的大小只有 85（寬）× 38（高）公釐，而傳統靜電束柱的高度則高達 500 - 800 公釐。請即親自體驗全球首見輕巧、不佔空間的桌上型 FE-SEM。

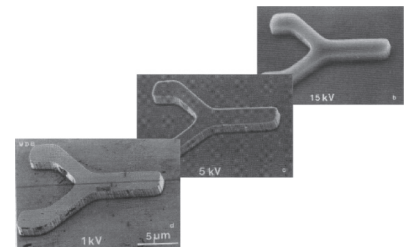


以 FE 效能進行真實的表面觀察

“難以觀察真實的表面形貌，因為導電層塗覆在非導電試樣上 ...”

“高能量束會破壞試樣表面 ...”

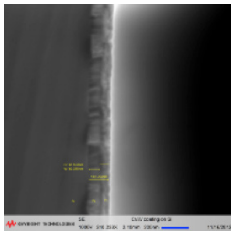
低電壓成像技術解決了這些問題。即時可控制的加速電壓可下降至最低 0.5 keV，而且因為不需要塗覆樣品，因此可顯示真實的表面形貌。



輕鬆更換樣品，5 分鐘內開始量測

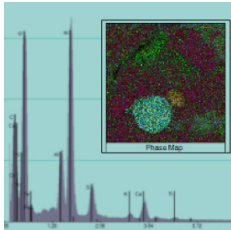
小型試驗室可顯著減少抽氣時間，有助於提高工作效率，特別是使用者需在短時間內相繼觀察大量樣品時。





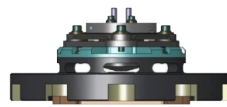
1keV 時，解析度 <10nm

透過非常低的加速電壓控制，可清楚觀察 Si 上厚度只有幾 nm 的 Cr/W 塗層。



也可使用元素分析

ESD (能量色散光譜) 選項提供定性和定量元素分析。



可重複的效能，無需重新調整

透過創新，是德科技專利式全靜電鏡片設計可消除任何遲滯效應，確保可重複的效能，無需不斷重新調整。



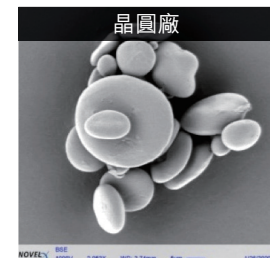
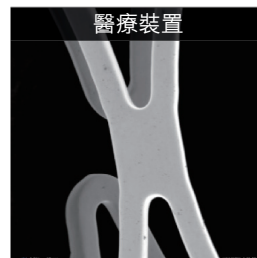
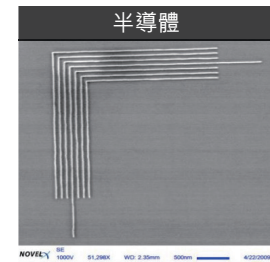
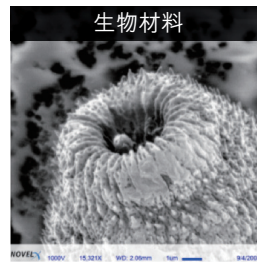
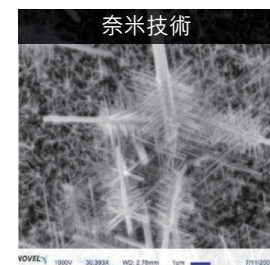
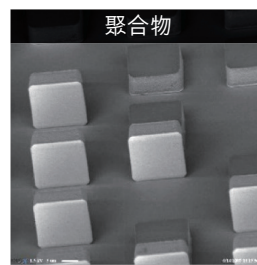
易於操作

大口徑樣品機台方便您輕易變換樣品。可程控的 X、Y、Z 機台會記住精確坐標，以利後期分析。

主要使用者

效能	
電子束電壓	500 至 2,000 V
電子束電流	0.2 至 1 nA
解析度	1,000 V 時為 < 10 nm
放大倍數	250 至 200,000 倍
掃描場	1 x 1 mm (最大值)
電子源	蕭特基場發射
檢測模式	SE、BSE、Topo
樣品參數	
樣品大小	100 x 60 mm (最大值)
樣品厚度	30 mm (最大值)
可視區域	50 x 30 mm (最大值)
真空系統	
試驗室真空度	1 e 至 4 Torr
渦輪幫浦	每秒 80 公升
超高真空 (UHV) 幫浦	具吸除功能的離子幫浦
體積、重量	
顯微鏡	581 (寬) x 670 (深) x 469 (高) mm，87 公斤
幫浦機組	203 (寬) x 254 (深) x 203 (高) mm，4 公斤
安裝 / 操作要求	
功率	100 至 240 Vac，50/60Hz
操作溫度	攝氏 15 至 30 度
操作濕度	20 - 80 % 相對濕度
氮氣 / 冷卻水	非必要

觀察範例



聯絡窗口 / 支援

有關是德科技電子量測產品、應用及服務的詳細資訊，可查詢我們的網站或來電洽詢

聯絡窗口查詢：

www.keysight.com.tw/find/contactus

本文件中的產品規格及說明如有修改，恕不另行通知。

© Keysight Technologies, 2016
Published in Japan, July 26, 2016

中文版：5992-1689ZHA

0000-08cS

www.keysight.com.tw